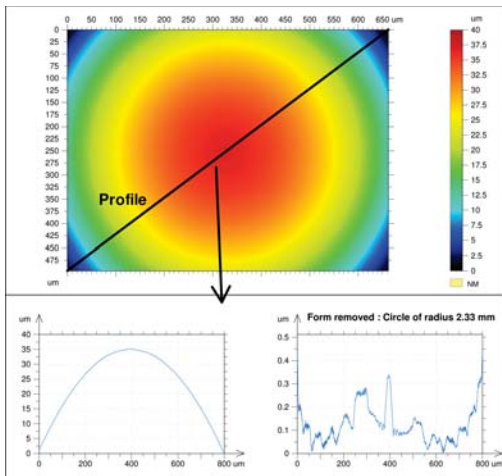
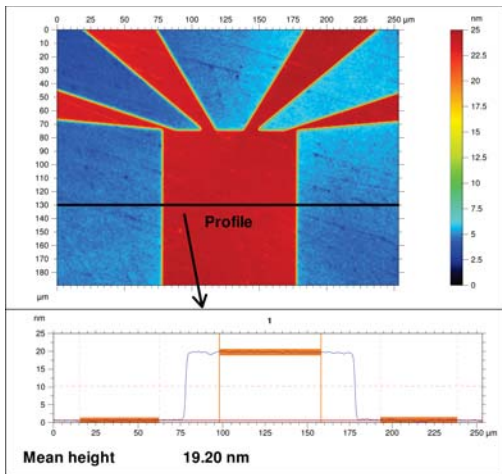


WEISSLICHTINTERFEROMETER / KONFOKALPROFILOMETER SENSOFAR PLμ2300



MESSMÖGLICHKEITEN

- Hellfeldmikroskopie
- Konfokalprofilmikroskopie
- Vertical Scanning Interferometry (VSI)
- Phase Shifting Interferometry (PSI)

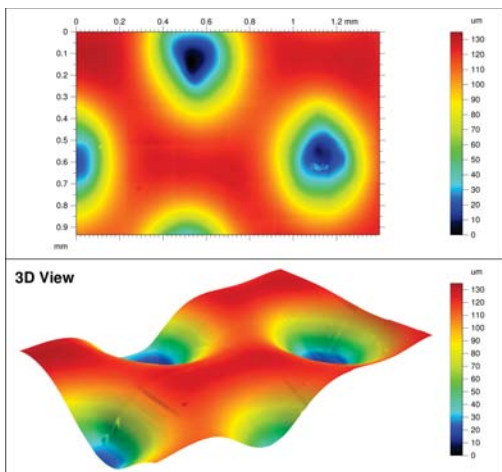


MESSPARAMETER (OBJEKTIVABHÄNGIG)

Lateralauflösung: > 300 nm
 Vertikalaufösung: < 1 nm
 Messfeld einzeln: ~ 1 x 1 mm²
 Messfeld stitching: < 154 x 154 mm²

PROBENTISCHPARAMETER

Verfahrenbereich: 154 x 154 x 32 mm³ (x/y/z)
 Verkippung: ± 3°
 Probentisch: 170 x 190 mm²
 max. Probenhöhe: 35 mm
 max. Probenmasse: 20 kg



MESSMETHODE: PSI

- Topographien mit < μm Höhenunterschied
- Rauheitsmessungen an glatten Proben

MESSMETHODE: VSI

- Topographien mit > μm Höhenunterschied
- Rauheitsmessungen an rauen Proben

MESSMETHODE: KONFOKAL

- Topographien mit > μm Höhenunterschied
- Rauheitsmessungen an sehr rauen Proben